

## New Release

## **LTEC Corporation**

Your most experienced partner in IP protection

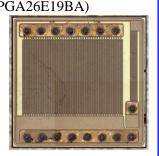
### Infineon製 GaNパワートランジスタ「IGT60R190D1S」構造解析、 プロセス解析レポート

株式会社エルテックは、Infineon製GaNパワートランジスタ「IGT60R190D1S」の構造解析および プロセス解析レポートをリリースしました。









**Package** 

チップ写真

#### 概要

「IGT60R190D1S」は、Infineon社が2018年に発売したCoolGaN™ Normally-Off 600V GaN パワートランジスタで、パナソニックのX-GaN PGA26E19BA GIT (Gate-Injection-Transistor: ゲート注入トランジスタ)と互換性があると言われています。

2015年に、InfineonとPanasonicは、Normally-Off 600V GaNパワートランジスタのデュアルソーシングを確立するための業務提携を発表しており、本製品はその合意に基ずく互換製品と想定されます。この解析レポートでエルテックは、両デバイスがどの程度互換性があるかを明らかにしています。

### 解析結果ポイント

構造解析レポートでは Infineon 「IGT60R190D1S」の詳細を、

プロセス解析レポートでは、下記のポイントに着目し、Infineon品とPanasonic品の互換性について明らかにしています。

- チップレイアウト、トランジスタ構造、および材料
- ・電気特性(Id-Vds、Ron、リーク電流および温度依存性)

### レポート内容、価格

- ○構造解析レポート:60万円(税別)
  - ・パッケージ外観、X線観察、チップ平面解析、チップ断面解析、GaN-epi層TEM-EDX分析、電気特性測定
- 〇プロセス解析レポート:40万円(税別)
  - ・構造解析結果に基づく、「IGT60R190D1S」の製造プロセスフロー
  - 電気特性解析
  - Panasonic品(PGA26E19BA)との解析結果比較、互換性について(構造、材料、電気特性比較と 異なる点に注目)



株式会社エルテック Phone: 072-787- 7385 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡4丁目42-8

e-mail: info@ltec.biz ホームページ: www.ltec.biz

# 構造解析レポート

【目	次】		頁
1		デバイスサマリー(表1)	3
	1-1	エグゼクティブサマリー	4
	1-2	解析結果まとめ	5
	1-3	GaNトランジスタの構造図と動作原理について	6
		表2: デバイス構造: GaN HEMT ······	7
		表3: デバイス構造: レイヤー材料・膜厚	8
2		パッケージ外観解析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
	2-1	外観•X線観察 ······	10
3		GaN HEMTチップ解析 ······	11
	3-1	平面チップ構成	12
	3-2	平面構造解析 (OM観察) ····································	13-23
	3-3	平面構造解析(SEM観察) ····································	24-26
	3-4	断面構造解析(SEM) ······	27
		チップ膜厚	27
		GaNエピ層 断面SEM像······	28-35
		チップ端部の断面SEM観察······	36-39
	3-5	TEM構造解析······	40-45
	3-6	TEM EDX分析結果······	46-48
	3-7	GaNエピ層のTEM EDXによる構造/材料分析	49
	3-8	TEM EDXの材料分析·······	50-73
4		電気特性解析·····	74-78



# プロセス解析レポート

【目	次】		頁
1		Infineon CoolGaN IGT60R190D1S	3
	1-1	エグゼクティブサマリー	3
	1-2	GaNチップ全体	4
	1-3	チップ端部	4
	1-4	デバイス構造: GaN-on-Si	5
	1-5	デバイス構造: GaN HEMT	6
	1-6	断面解析によるレイヤ確認	7
2		Infineon IGT60R190D1S vs Panasonic PGA26E19BA 解析結果比較	8
		表2 デバイス構造: GaN-on-Si HEMT	9
		表3 デバイス構造: レイヤー材料・膜厚	10
3		プロセスフロー	11
	3-1	GaN HEMTのフロントエンドウェーハプロセスフロー(推定)	11
	3-2	GaN HEMTのプロセス・シーケンス断面図	12-15
4		電気特性解析	16
	4-1	他社GaNトランジスタとの特性比較(データシート)	17–18
	4-2	電気特性評価: Id-Vds特性	19-21
	4-3	電気特性評価: OFF状態リーク電流特性	22-24
	4-4	電気特性評価: ブレークダウン特性	25
	4-5	電気特性評価:容量特性	26
	4-6	データシートからの特性比較(注意点)	27-29
5		関連文献目録	30

